

テスト密度に着目した結合テストリスクの構造分析

日本ユニシス株式会社

丸山泰生

yasunari.maruyama@unisys.co.jp

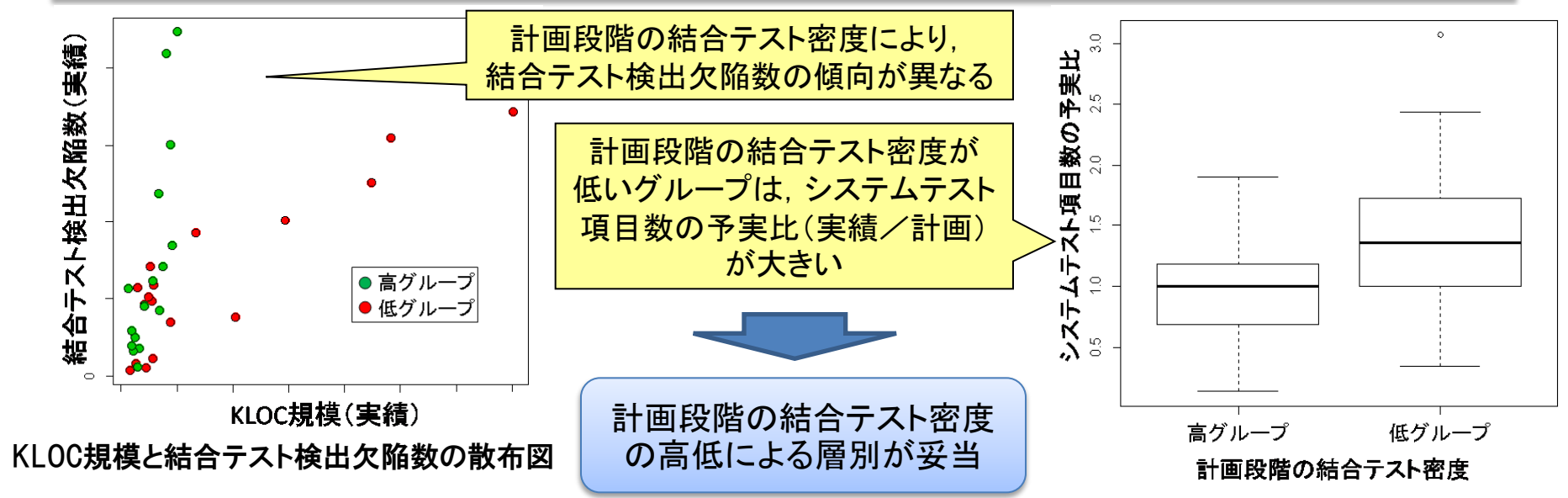
開発における問題点

結合テストリスク(結合テスト項目数および結合テスト工数の超過)から失敗につながるプロジェクトが問題となっている。
しかし、結合テスト工程のプロセスメトリクス分析により問題構造を把握し、対策立案につなげる活動が今まで十分に出来ていなかった。

手法・ツールの適用による解決

複合的・多段階の因果関係をモデル化でき、標準化偏回帰係数の大小によりメトリクス間の寄与の強さを議論できる階層的重回帰分析を用いて、プロセスメトリクス間の構造分析を実施した。
分析の結果、計画段階の結合テスト密度の高低によって結合テストリスクの構造に違いがあることを確認した。

計画段階の結合テスト密度による層別



プロセスメトリクス間の構造分析

